

**ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
СКОРОСТИ РЕЛАКСАЦИИ АКЦЕПТОРНОГО ЦЕНТРА В
КРЕМНИИ μ^- SR-МЕТОДОМ**

T.Н.Мамедов¹⁾, Д.Г.Андианов⁺, Д.Герлах*, К.И.Грицай, В.Н.Горелкин[□],
O.Корманн[△], Я.Майор^{△,∇}, A.В.Стойков, M.Шевчик[∇], У.Циммерман*

**Объединенный институт ядерных исследований
141980 Дубна, Московская обл., Россия**

⁺**Государственный научно-исследовательский и проектный институт
редкометаллической промышленности "Гиредмет"
109017 Москва, Россия**

^{*}**Paul Scherrer Institut, CH-5232 Villigen PSI, Switzerland**

[□]**Московский физико-технический институт
141700 Долгопрудный, Московская обл., Россия**

[△]**Max-Planck-Institut für Metallforschung, D-70569 Stuttgart, Germany**

[∇]**Universität Stuttgart, Institut für Theoretische und Angewandte Physik
D-70569 Stuttgart, Germany**

Поступила в редакцию 13 апреля 2000 г.

Приведены результаты исследований температурной зависимости остаточной поляризации отрицательных мюонов в кристаллическом кремнии с примесью фосфора ($3.2 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-3}$, $2.3 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$ и $4.5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$) и алюминия ($2 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$ и $2.4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$). Измерения были выполнены в поперечном спину мюона магнитном поле 2000 Гс в диапазоне температур 4 – 300 К. Определена температурная зависимость скорости релаксации магнитного момента мелкого акцепторного центра Al в недеформированном образце кремния и получена оценка величины константы сверхтонкого взаимодействия магнитных моментов мюона и электронной оболочки мюонного атома μ Al в кремнии.

PACS: 76.75.+i

В полупроводниках с кристаллической структурой алмаза мелкие акцепторные центры, в отличие от мелких доноров, как теоретически, так и экспериментально исследованы недостаточно [1]. Например, современные теоретические расчеты расходятся в предсказании энергии основного состояния мелкого акцептора в таких полупроводниках как Si, GaP, InP (см. [2–4]). Известно всего несколько экспериментальных работ, в которых мелкие акцепторные центры в кремнии изучались методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) [5–8].

Как было показано в теоретической [9] и экспериментальных [10–13] работах, метод вращения спина отрицательного мюона (μ^- SR) позволяет изучать поведение акцепторных центров в полупроводниках, и его результаты могут существенно дополнить данные, получаемые другими ядерно-физическими методами.

Поведение поляризации отрицательного мюона в кремнии зависит от зарядового состояния акцепторного центра, образующегося в результате захвата мюоном

¹⁾ e-mail: tmamedov@nu.jinr.ru

кремния. Поскольку кремний является диамагнитным веществом (влияние изотопа Si²⁹ с отличным от нуля ядерным магнитным моментом пренебрежимо мало), то в ионизованном (диамагнитном) состоянии акцепторного центра во внешнем, поперечном спину мюона магнитном поле должна наблюдаться незатухающая во времени прецессия вектора поляризации на частоте свободного спина. В нейтральном (парамагнитном) состоянии возможны релаксация и сдвиг частоты прецессии спина мюона из-за взаимодействия магнитных моментов мюона и электронной оболочки акцепторного центра. Магнитный момент мелкого акцепторного центра в кремнии характеризуется квантовым числом $j = 3/2$ [14]. Аналитические выражения для поведения поляризации отрицательных мюонов в случае $j \geq 1$ были получены Горелкиным и др. [15]. В предположении, что скорость релаксации магнитного момента электронной оболочки (ν) намного больше константы сверхтонкого взаимодействия магнитных моментов мюона и электронной оболочки (A_{hf}), сдвиг частоты прецессии ($\Delta\omega$) и скорость релаксации спина мюона (λ) зависят от A_{hf} и ν следующим образом [15]:

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_0} = \frac{g\mu_B}{2\mu_\mu} \cdot \frac{j(j+1)\hbar A_{hf}}{3k_B T} + \frac{A_{hf}^2}{2(\nu^2 + \omega_e^2)}, \quad (1)$$

$$\lambda = \frac{j(j+1)}{3} \left(\frac{A_{hf}^2}{\nu} + \frac{A_{hf}^2\nu}{\nu^2 + \omega_e^2} \right), \quad (2)$$

где $\Delta\omega = \omega(T) - \omega_0$ (ω_0 – угловая частота прецессии спина мюона в диамагнитном состоянии мюонного атома); $\hbar = 2\pi\hbar$ – постоянная Планка; k_B – постоянная Больцмана; μ_B и μ_μ – магнетон Бора для электрона и мюона, соответственно; g – g -фактор акцепторного центра; $\omega_e = g\mu_B B/\hbar$ – угловая частота прецессии магнитного момента электронной оболочки акцепторного центра во внешнем магнитном поле B .

В случае $j = 1/2$ выражения (1) и (2) совпадают с хорошо известными формулами для положительного мюона в атоме мюония (см., например, [16]).

В настоящей работе представлены результаты μ^- SR исследований для пяти монокристаллических образцов кремния (три образца n -типа с примесью фосфора: $3.2 \cdot 10^{12}$, $2.3 \cdot 10^{15}$, $4.5 \cdot 10^{18}$ см⁻³ и два образца p -типа с примесью алюминия: $2 \cdot 10^{14}$, $2.4 \cdot 10^{18}$ см⁻³).

Измерения были выполнены на установке “Stuttgart μ SR Spectrometer” [17] расположенной на мюонном канале μ E4 ускорителя протонов института Пауля Шеррера (Швейцария). Поперечное спину внешнее магнитное поле, создаваемое кольцами Гельмгольца на образце, составляло 2000 Гс. Температура образцов стабилизировалась с точностью 0.1 К в диапазоне (4.2 – 300) К. Ширина временного канала спектрометра составляла 0.625 нс, общее количество каналов в спектре было 16000.

Процедура восстановления функции поляризации отрицательного мюона из экспериментальных μ^- SR спектров подробно описана в [13]. Из экспериментальных данных определялись температурные зависимости скорости релаксации и сдвига частоты прецессии спина мюона для релаксирующей компоненты поляризации, а в случае наблюдения релаксирующего и нерелаксирующего компонентов также их относительные амплитуды и скорость ионизации акцепторного центра (переход $\mu\text{Al}^0 \rightarrow \mu\text{Al}^-$).

Экспериментальные результаты по температурной зависимости скорости релаксации спина мюона для двух образцов кремния с примесью алюминия и для образца

с примесью фосфора ($4.5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$) представлены на рис.1 и 2, соответственно. В кремнии с высокой концентрацией примеси фосфора ($4.5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$), так же как ранее [13] для образца с примесью сурьмы ($2 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$), обнаружены релаксирующий и нерелаксирующий компоненты в прецессии спина мюона при $T \lesssim 30$ К. Соответственно, для данного образца из экспериментальных данных кроме $\Delta\omega$ и λ была определена ν_{tr} – скорость ионизации акцепторного центра. Температурная зависимость ν_{tr} приведена на рис.2. Для всех остальных исследованных образцов, в том числе и в случае высокой концентрации примеси алюминия ($2 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$), наблюдалась только релаксирующая компонента в поляризации спина мюона при $T < 50$ К, при этом амплитуда прецессии спина мюона в нулевой момент времени соответствовала амплитуде прецессии при комнатной температуре.

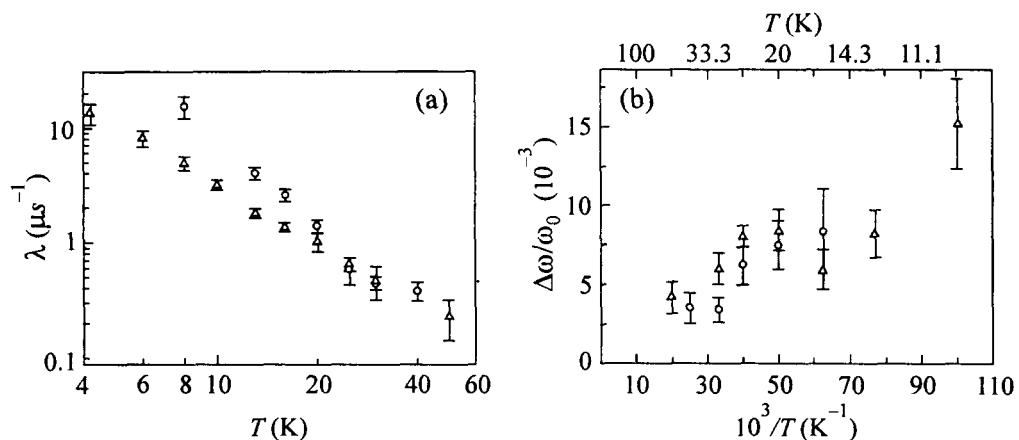


Рис.1. Температурные зависимости скорости релаксации (а) и сдвига частоты прецессии спина мюона (б) для образцов кремния с различной концентрацией примеси алюминия: $\circ - 2 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$, $\Delta - 2.4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$

Температурная зависимость сдвига частоты для всех исследованных образцов не противоречит $1/T$ закону Кюри (см., например, рис.1). Это означает, что вклад второго слагаемого в выражении (1) для сдвига частоты, по сравнению с первым – парамагнитным членом, мал. В пренебрежении вторым членом в (1) из экспериментальных данных по $\Delta\omega/\omega_0$ была оценена величина A_{hf} (величина g принималась равной 1.07 [8]). Величины $A_{hf}/2\pi$ для всех исследованных образцов оказались примерно одинаковыми и составляют $\approx 3 \cdot 10^7 \text{ с}^{-1}$. Следует отметить, что данное значение $A_{hf}/2\pi$ примерно в 20 раз меньше частоты осцилляций спина мюона, обнаруженной ранее в эксперименте с образцом кремния собственной проводимости в нулевом внешнем магнитном поле при 6 К [18]. Наблюдение осцилляций спина мюона в нулевом внешнем магнитном поле является наиболее надежным и прямым способом определения A_{hf} , однако, к сожалению, результаты работы [18] не были подтверждены повторными экспериментами. Причина такого значительного расхождения наших оценок константы сверхтонкого взаимодействия и результатов [18] пока не ясна.

В предыдущей работе [13] мы показали, что релаксация спина мюона в кремнии обусловлена спин-решеточной релаксацией магнитного момента акцепторного центра. Температурные зависимости спин-решеточной релаксации вида T^q ($1 \leq q \leq 9$)

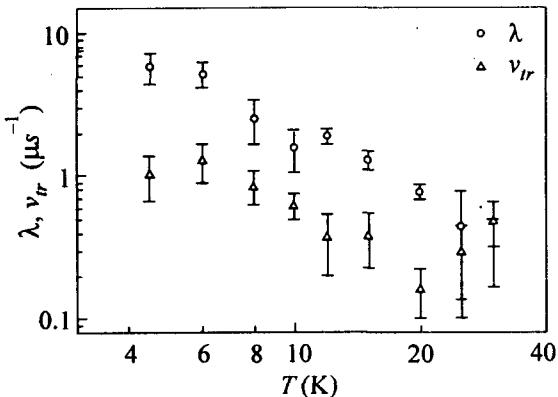


Рис.2. Температурные зависимости скорости релаксации λ спина мюона в парамагнитном состоянии акцепторного центра и скорости ν_{ir} перехода акцепторного центра из парамагнитного в димагнитное состояние

наблюдались в различных материалах методом ЭПР (см., например, [19]). Нам известна лишь одна теоретическая работа [20], где изучалась температурная зависимость скорости спин-решеточной релаксации магнитного момента акцепторного центра в идеальном кристалле кремния. Согласно [20], в диапазоне температур 10 – 100 К основной вклад в спин-решеточную релаксацию дает рамановское рассеяние фононов, и скорость релаксации зависит от температуры как T^5 .

Настоящие результаты по температурной зависимости скорости релаксации спина мюона в кремнии описывались зависимостью (2) в предположении, что скорость релаксации магнитного момента акцепторного центра зависит от температуры как

$$\nu(T) = C \cdot T^q. \quad (3)$$

При обработке экспериментальных данных принималось, что $j = 3/2$ и $A_{Cq}/2\pi = 3 \cdot 10^6$ с⁻¹. Полученные значения параметров C и q для различных образцов приведены в таблице. Следует отметить, что в отличие от значений параметра C , величина q практически не зависит от A_{Cq} . Как можно видеть из таблицы, значение показателя степенной зависимости q находится в пределах от 2 до 3 для различных образцов. Таким образом, температурные зависимости скорости релаксации магнитного момента акцепторного центра, полученные в настоящей работе, существенно отличны от ожидаемой для идеального кристалла зависимости T^5 [20]. Расхождение экспериментальных результатов и теоретических предсказаний может быть обусловлено тем фактом, что в расчетах [20] не учитывалось время жизни фононов, в то время как ниже температуры Дебая время жизни фононов меняется как $1/T^2$, а в ряде случаев даже сильнее [21]. Ослабление температурной зависимости (уменьшение параметра q) при концентрации примеси выше $\sim 10^{15}$ см⁻³ может быть обусловлено изменениями фононного спектра, вызванными деформацией кристалла примесными атомами [22].

**Сводная таблица параметров C и q для различных акцепторных центров
(n – концентрация примеси)**

	Si : Al	Si : Al	Si : P	Si : P	Si : P
n , см ⁻³	$2 \cdot 10^{14}$	$2.4 \cdot 10^{18}$	$3.2 \cdot 10^{12}$	$2.3 \cdot 10^{15}$	$4.5 \cdot 10^{18}$
$C \cdot 10^{-7}$, с ⁻¹	0.2 ± 0.1	7.3 ± 1.7	0.27 ± 0.09	0.45 ± 0.16	22.0 ± 11.0
q	3.10 ± 0.2	2.1 ± 0.1	3.1 ± 0.1	2.9 ± 0.10	1.8 ± 0.2
ν ($T = 4$ К), с ⁻¹	$1.5 \cdot 10^8$	$1.3 \cdot 10^9$	$2.0 \cdot 10^8$	$2.5 \cdot 10^8$	$2.6 \cdot 10^9$

В последней строке таблицы представлены значения ν при 4 К. Данные значения скорости релаксации магнитного момента акцепторного центра не противоречат результатам ЭПР экспериментов в образцах кремния в условиях одноосного сжатия [5–7], однако данные ЭПР по скорости релаксации магнитного момента мелких акцепторов для недеформированных образцов кремния отсутствуют.

Ионизация акцептора при $T \lesssim 30$ К (см. рис.2) может быть обусловлена захватом электрона из зоны проводимости или взаимодействием акцептора с ближайшей донорной примесью, в результате чего оба примесных центра переходят из нейтрального в ионизованное состояние ($A^0D^0 \rightarrow A^-D^+$) [23]. Из ЭПР исследований [24] следует, что кремний n -типа при концентрации примеси $\sim 3 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ становится вырожденным полупроводником (в спектре ЭПР наблюдается только одна линия, обусловленная электронами зоны проводимости). В случае вырожденного n -типа кремния оба механизма ионизации могут быть рассмотрены как захват акцептором электрона из зоны проводимости. Соответственно, скорость захвата электрона нейтральным акцептором определяется как (см., например, [25]) $\nu_{tr} = \beta n_e$, где β – коэффициент захвата, n_e – концентрация свободных электронов. Принимая $n_e = n_D = 4.5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$, по значениям ν_{tr} , приведенным на рис.2, находим, что величина $\beta(\text{Al}^0)$ в диапазонах температур $4.5 \leq T \leq 10$ К и $12 \leq T \leq 30$ К примерно равна $2 \cdot 10^{-13} \text{ см}^3 \cdot \text{с}^{-1}$ и $7 \cdot 10^{-14} \text{ см}^3 \cdot \text{с}^{-1}$, соответственно. Нам известна лишь одна работа [26], где определенная методом фотовозбуждения величина $\beta(\text{Al}^0)$ составила $4 \cdot 10^{-8} \text{ см}^3 \cdot \text{с}^{-1}$. Однако необходимо отметить (см., например, [27]), что имеет место значительный (до 5 порядков) разброс экспериментальных данных по коэффициенту захвата электронов нейтральными акцепторами (B, In, Ga) в кремнии, причем значения β , полученные в [26], систематически превышают данные измерений другими методами. Полученная нами оценка $\beta(\text{Al}^0)$ при $T = 30$ К находится в пределах значений $\beta(\text{In}^0) = 8 \cdot 10^{-15} \text{ см}^3 \cdot \text{с}^{-1}$ и $\beta(\text{In}^0) = 2 \cdot 10^{-12} \text{ см}^3 \cdot \text{с}^{-1}$, определенных методом релаксации фотопроводимости в работах [25] и [28], соответственно.

В заключение отметим, что на основе настоящих экспериментальных данных и аналитических выражений для скорости релаксации и сдвига частоты прецессии спина мюона в атоме с $j = 3/2$ [15] получена оценка величины константы сверхтонкого взаимодействия магнитных моментов мюона и электронной оболочки мюонного атома μAl и определен вид температурной зависимости скорости релаксации магнитного момента мелкого акцепторного центра в недеформированном образце кремния. Также получена оценка для коэффициента захвата электронов нейтральным атомом алюминия в кремнии.

Авторы выражают благодарность дирекции института Пауля-Шеррера (Швейцария) за предоставление возможности проведения настоящих измерений. Частичное финансирование настоящих исследований осуществлялось Федеральным министерством по образованию и научным исследованиям Германии (Bundesministerium für Bildung und Forschung), контракты 03-MA5ST1 и 03-MA5ST2.

-
1. G.D.Watkins, ФТТ **41**, 826 (1999).
 2. A.Baldereschi and N.O.Lipari, Phys. Rev. **B8**, 2697 (1973).
 3. И.А.Меркулов и А.В.Родина, ФТП **28**, 321 (1994).
 4. А.В.Малышев, И.А.Меркулов, А.В.Родина, ФТП **30**, 159 (1996).
 5. G.W.Ludwig and H.H.Woodbury, Bull. Am. Phys. Soc. **6**, 118 (1961).
 6. G.Feher, J.C.Hensel, and E.A.Gere, Phys. Rev. Lett. **5**, 309 (1960).

7. Б.Г.Журкин, Н.А.Пенин, Н.Н.Сибельдин, ФТП **2**, 827 (1968).
8. H.Neubrand, Phys. Stat. Sol. (b)**86**, 269 (1978).
9. В.Н.Горелкин и В.П.Смилга, ЖЭТФ **68**, 1201 (1974).
10. В.Н.Горелкин, В.Г.Гребинник, К.И.Грицай и др., Ядерная физика **56**(10), 29 (1993).
11. W.Beez, T.Grund, M.Hampele et al., *PSI Annual Report F1*, Annex I, Villigen, Switzerland: PSI, 1994, p.125.
12. В.Н.Горелкин, В.Г.Гребинник, К.И.Грицай и др., Письма в ЖЭТФ **68**, 539 (1996).
13. Т.Н.Мамедов, В.Н.Дугинов, Д.Герлах и др., Письма в ЖЭТФ **68**, 61 (1998).
14. Г.Л.Бир и Г.Е.Пикус, *Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках*, М.: Наука, 1972.
15. V.N.Gorelkin and A.S.Baturin, in abstracts of the 8th International Conference on Muon Spin Rotation, Relaxation and Resonance, August 30 – September 3 1999, Les Diablerets, Switzerland, p.II-10. (Труды конференции в печати: *Physica B*.)
16. В.П.Смилга и Ю.М.Белоусов, *Мюонный метод исследования вещества*, М.: Наука, 1991.
17. R.Scheuermann, J.Schmidl, A.Seeger et al., Hyperfine Interact. **106**, 295 (1997).
18. M.Koch, K.Majer, J.Major et al., Hyperfine Interact. **65**, 1039 (1990).
19. С.А.Альтшуллер и Б.М.Козырев, *Электронный парамагнитный резонанс соединений элементов промежуточных групп*, М.: Наука, 1972.
20. Y.Yafet, J. Phys. Chem. Solids **26**, 647 (1965).
21. И.Я.Померанчук, *Собрание научных трудов*, т.1, М.: Наука, 1972.
22. Ч.Киттель, *Введение в физику твердого тела*, М.: Наука, 1978.
23. R.C.Enck and A.Honig, Phys. Rev. **177**, 1182 (1969).
24. G.Feher, Phys. Rev. **114**, 1219 (1959).
25. Я.Е.Покровский, К.И.Свистунова, ФТТ **7**, 1837 (1965).
26. M.Loewenstein and A.Honig, Phys. Rev. **144**, 781 (1966).
27. А.Милнс, *Примеси с глубокими уровнями в полупроводниках*, М.: Мир, 1977.
28. Я.Е.Покровский, К.И.Свистунова, ФТТ **5**, 1880 (1963).